



CAS IR Grid / 上海应用物理研究所 / 中国科学院上海应用物理研究所 / 中科院上海应用物理研究所2011-2017年

薄膜X射线衍射原位测试装置

文献类型：专利

入库方式：OAI收割
来源：[上海应用物理研究所](#)

| | | |
|----|----|----|
| 浏览 | 下载 | 收藏 |
| 32 | 4 | 0 |

作者 王瑞; 刘春泽; 朱大明; 顾月良; 阴广志; 李晓龙

发表日期 2017-04-05

专利号 CN206074486U

著作权人 中国科学院上海应用物理研究所

国家 中国

文献子类 实用新型

英文摘要 本实用新型提供一种薄膜X射线衍射原位测试装置，包括一冷热台腔体和与其相连的一温度控制机构及一冷却机构，所述冷热台腔体包括可拆卸连接的一样品台底座和一压盖，所述压盖与所述样品台底座配合形成一内腔；还包括：一湿度控制机构，所述湿度控制机构连接所述冷热台腔体。本实用新型的一种薄膜X射线衍射原位测试装置可对反应腔体进行高低温控制、湿度控制并可实现原位的电学测试功能，具有调节自由度大、调节精度高、操作便捷、安全度高和成本低的优点。

公开日期 2017-04-05

申请日期 2016-09-18

语种 中文

源URL [<http://ir.sinap.ac.cn/handle/331007/33605>]

专题 上海应用物理研究所_中科院上海应用物理研究所2011-2017年

推荐引用方式 王瑞,刘春泽,朱大明,等. 薄膜X射线衍射原位测试装置. CN206074486U. 2017-04-05.

GB/T 7714

其他版本

除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。

» [欧盟学术资源开放存取平台](#) | [CALIS高校机构知识库](#) | [台湾学术机构典藏](#) | [香港机构知识库整合系统](#) | [网站地图](#) | [意见反馈](#)

版权所有 ©2023 中国科学院 - 运行维护：中国科学院兰州文献情报中心/中国科学院西北生态环境资源研究院 - Powered by CSpace

0931-8270076 发送邮件

陇ICP备2021001824号-8

甘公网安备 62010202001088号